

Single Diode

Schottky Barrier Diode

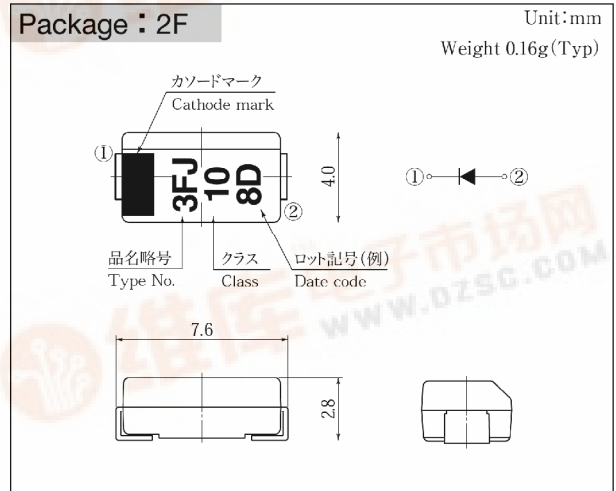
D3FJ10

100V 3A

- | | |
|--------------|-----------------------------------|
| 特長 | Feature |
| ● 小型SMD | ● Small SMD |
| ● Tj=150°C | ● Tj=150°C |
| ● 低Ir= 0.4mA | ● Low Ir=0.4mA |
| ● 熱暴走を起こしにくい | ● Resistance for thermal run-away |

- | | |
|----------------|---|
| 用途 | MainUse |
| ● スイッチング電源 | ● Switching Regulator |
| ● DC/DC コンバータ | ● DC/DC Converter |
| ● 家電、ゲーム、OA 機器 | ● Home Appliance, Game, Office Automation |
| ● 通信、ポータブル機器 | ● Communication, Portable set |

■外観図 OUTLINE



外形図については新電元Webサイト又は〈ダイオードカタログ・技術資料編〉を参照下さい。捺印表示については捺印仕様をご確認下さい。
For details of the outline dimensions, refer to our web site or the diode technical data book. As for the marking, refer to the specification "Marking, Terminal Connection".

■定格表 RATINGS

●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合 Tl = 25°C)

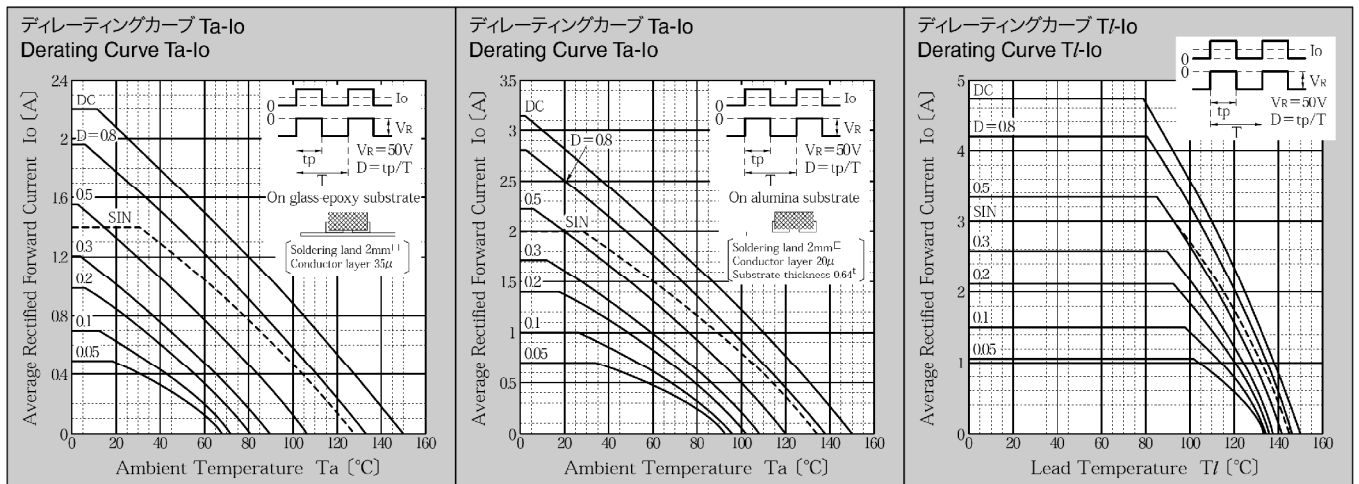
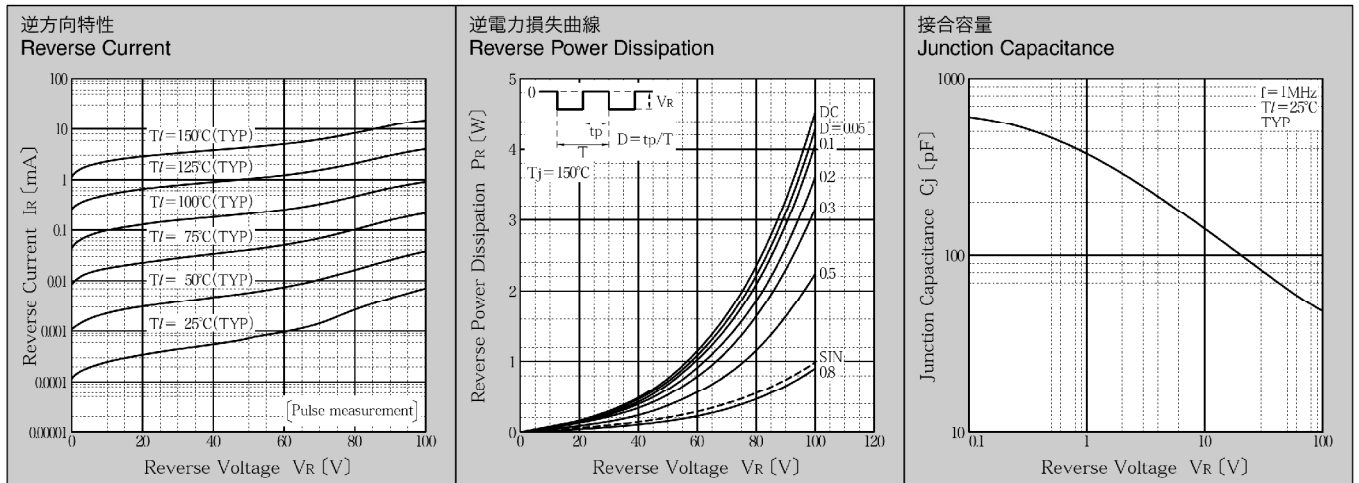
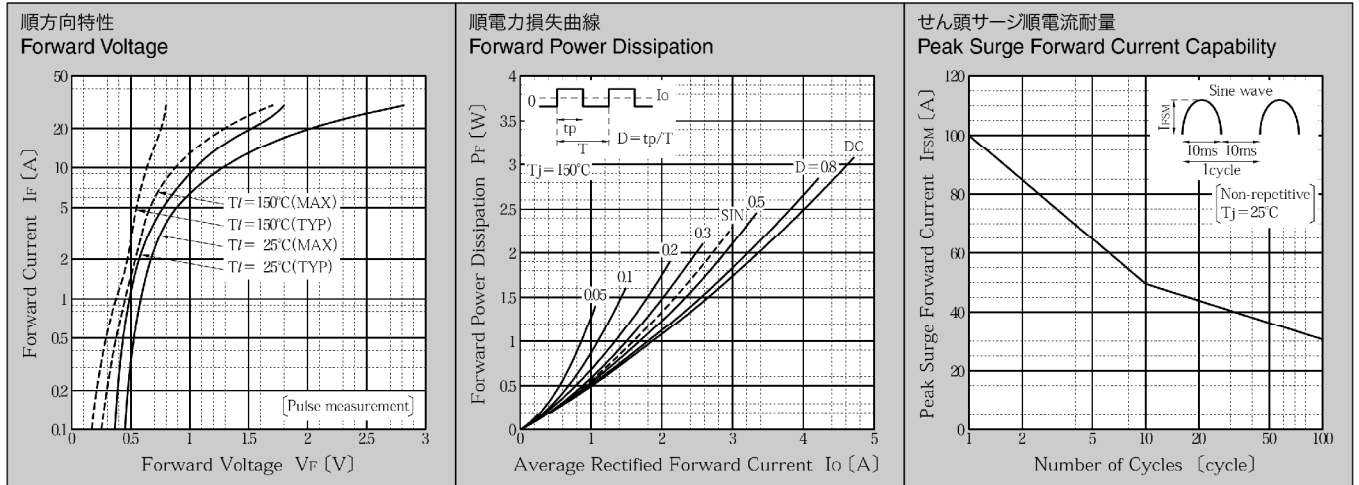
項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	品名 Type No.	D3FJ10	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	Tstg			-55~150	°C
接合部温度 Operation Junction Temperature	Tj			150	°C
せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage	V _{RM}			100	V
出力電流 Average Rectified Forward Current	I _O	50Hz正弦波, 抵抗負荷 50Hz sine wave, Resistance load	Ta = 30°C プリント基板実装 On glass-epoxy substrate	1.4	A
			Ta = 28°C アルミナ基板実装 On alumina substrate	2.0	
			Tl = 92°C	3.0	
せん頭サージ順電流 Peak Surge Forward Current	I _{FSM}	50Hz正弦波, 非繰り返し1サイクルせん頭値, Tj = 25°C 50Hz sine wave, Non-repetitive 1 cycle peak value, Tj = 25°C		100	A

●電氣的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合 Tl = 25°C)

順電圧 Forward Voltage	V _F	I _F = 3.0A, パルス測定 Pulse measurement	MAX 0.75	V
逆電流 Reverse Current	I _R	V _R = V _{RM} , パルス測定 Pulse measurement	MAX 0.4	mA
接合容量 Junction Capacitance	C _j	f = 1MHz, V _R = 10V	TYP 143	pF
熱抵抗 Thermal Resistance	θ _{jl}	接合部・リード間 Junction to lead	MAX 23	°C/W
			MAX 115	
	θ _{ja}	接合部・周囲間 Junction to ambient	MAX 80	



■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS



* Sine waveは50Hzで測定しています。
* 50Hz sine wave is used for measurements.
* 半導体製品の特性は一般的にバラツキを持っています。
Typical is a statistical average of the device's ability.
* Semiconductor products generally have characteristic variation.
Typical is a statistical average of the device's ability.